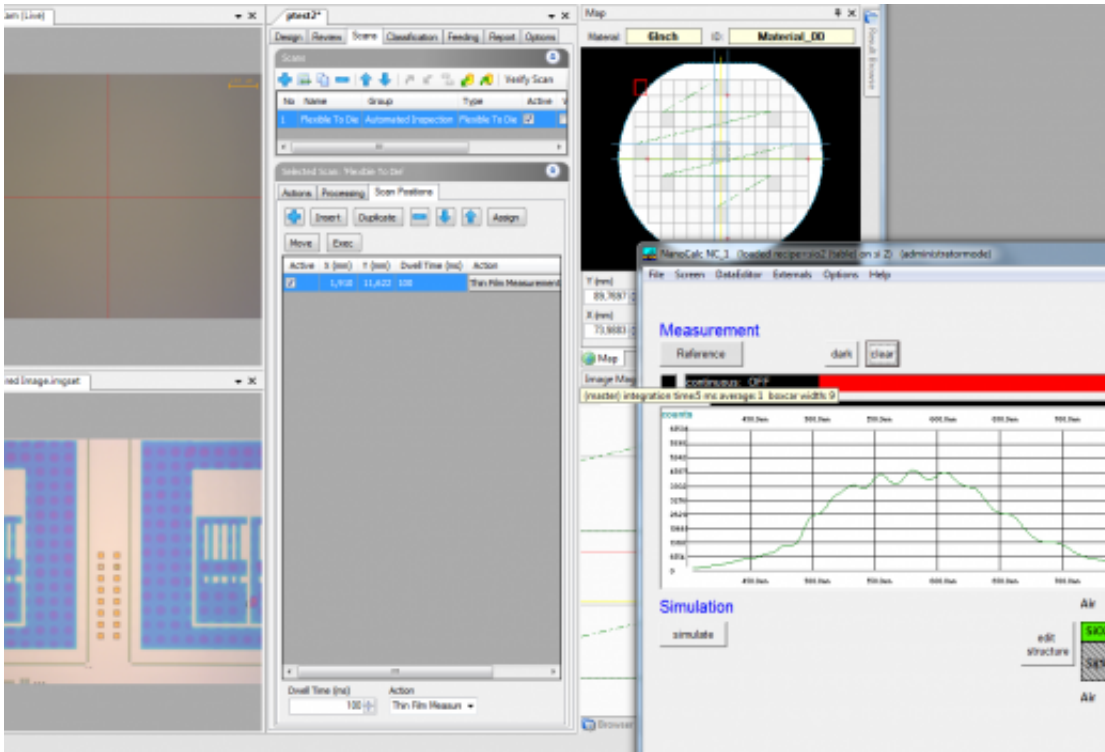
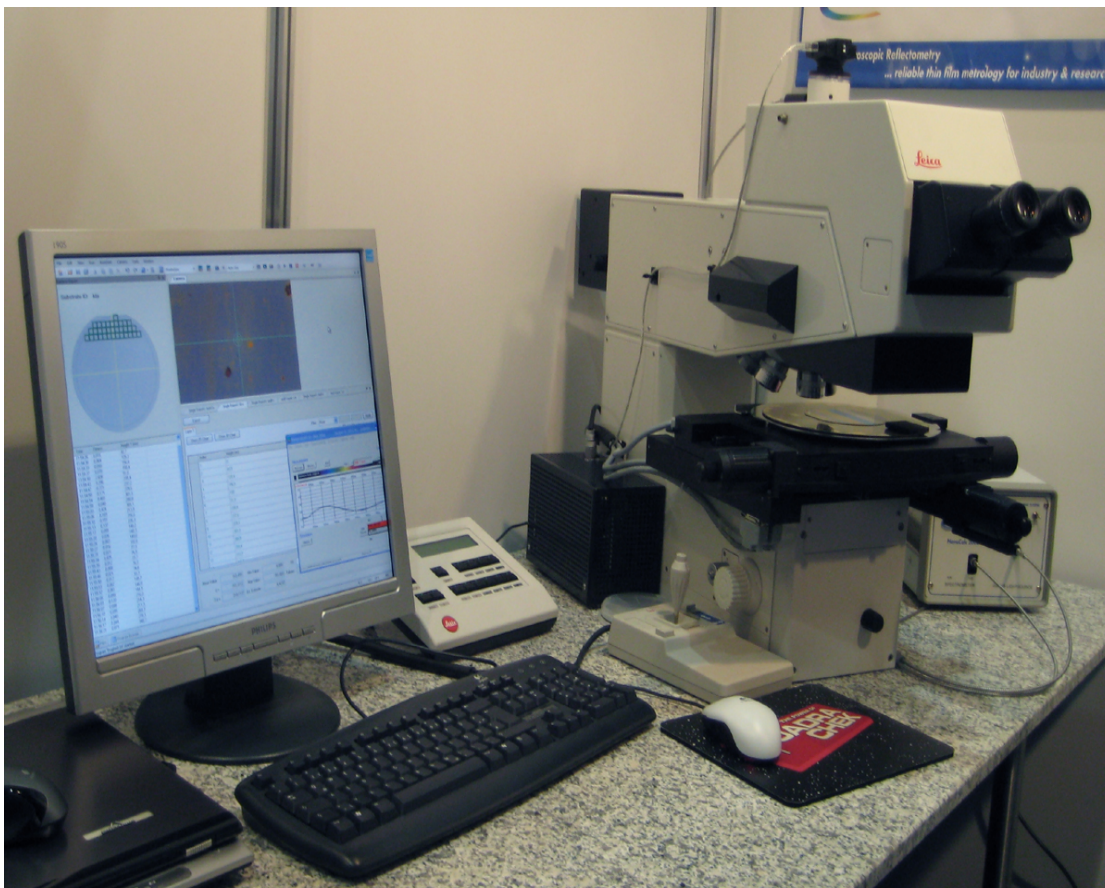


Schichtdickenmessung (Thin Film Measurement)

Mikroskop zur Schichtdickenmessung



Leistungsfähiges System für Schichtdicken zwischen 50 nm und ca. 50 µm.



Halbleiterfertigung:

- Fotolack
- Oxide
- Nitride

Flüssigkristall-Displays:

- Zellabstände
- Polyimide
- ITO

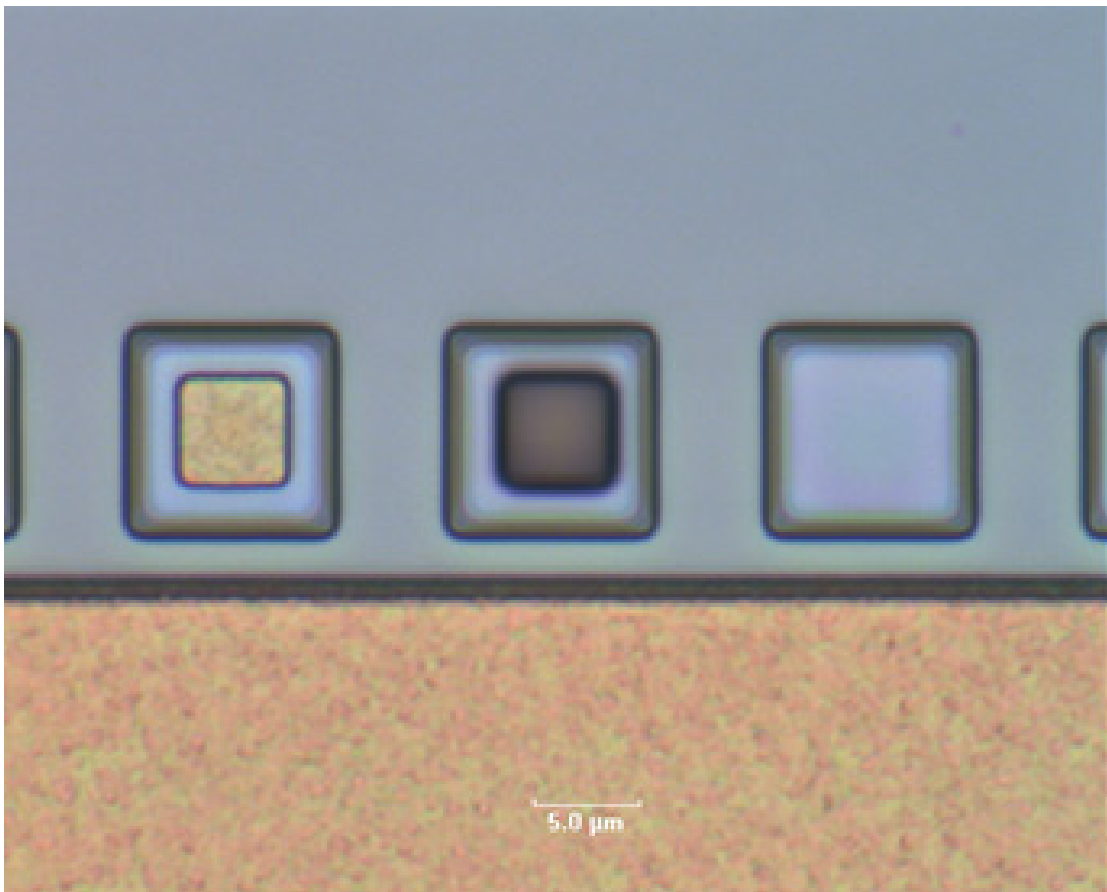
Optische Beschichtungen:

- Härtebeschichtungen
- Antireflexionsbeschichtungen
- Filter

Promicron DM12000-TF



Universelles Halbleiter-Mikroskop mit der Option zur Schichtdickenmessung.



Anfrage